

エネルギー分散形蛍光X線分析装置 (XRF) 操作説明会のご案内



日本電子株式会社のホームページより



固体・液体サンプルに含まれる元素の濃度をそのまま簡単に測定できる。

装置の使用例1

プレチェック、クロスチェック

- ・特徴：XRFとSEM EDSを併用することで、目的元素の所在を絞り込む事ができる。
- ・分析事例：XRFを用いることで砂粒群にZrが含まれているかを迅速に判別することができる。また、SEM EDSを利用するとZrが存在する砂粒を特定することができる。

装置の使用例2

低真空液体試料カプセル

- ・特徴：ヘリウムフリーで液中軽元素の分析が可能
- ・分析事例：食品（豆乳）中のミネラル成分（微量なMg）の検出・定量ができる。

◆ 対象者：エネルギー分散形蛍光X線分析装置（XRF、日本電子製、JSX-1000S）を使用予定の教員と学生

◆ 日時：令和8年9月17日（木）

座 学：10：00～12：00（原理等）

実機1班：（教員向け）13：00～14：30

実機2班：（学生向け）15：00～16：30

◆ 場所：

座学：E棟1階 リサーチコモンズ（計測センター前）

取説：E棟1階 計測センター 暗室

◆ 申込方法：下記URL、或いは右記のQRコードより

URL：<https://forms.cloud.microsoft/r/vzvgu2zZRL>

◆ 申込期限：9月11日（金）

◆ お問い合わせ先：

総合研究機構事務室 宋（6951）、柳（2297）、稲吉（2216）

